

Kurzbeschreibung

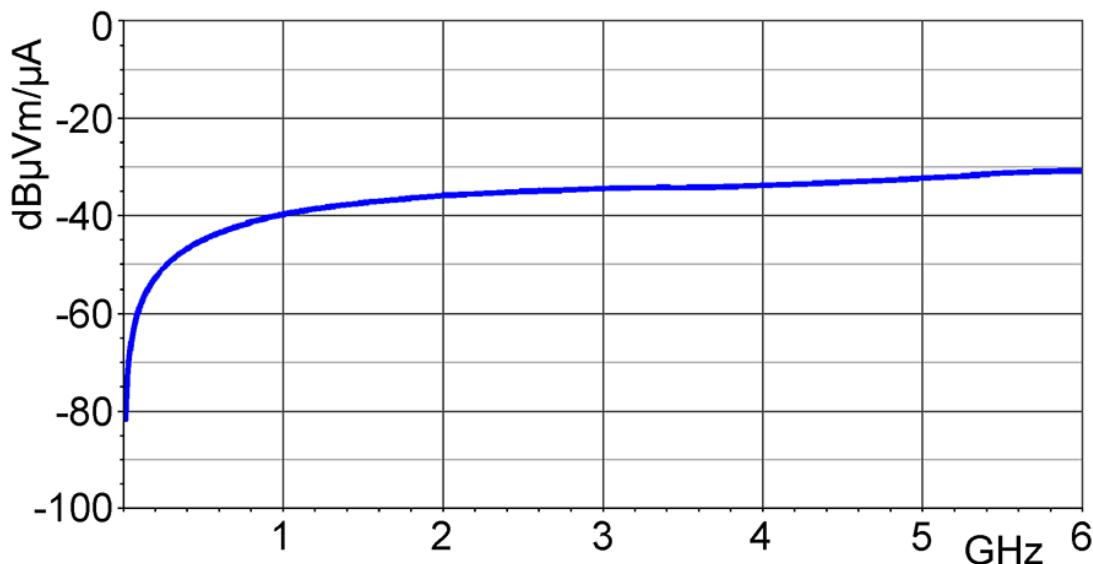
Die Scannersonde XFS-R 3-1 dient der Messung von HF-Magnetfeldern mit hoher Auflösung auf der Baugruppe, z.B. im Bereich um Pins und Gehäuse von ICs, Leiterzügen Stützkondensatoren und EMV-Bauelementen.

Die Magnetfeldscannersonde XFS-R 3-1 ist für Messungen dicht an Bauelementen im Bereich hoher magnetischer Feldstärken geeignet. Die Nahfeldsonde hat eine Mantelstromdämpfung und ist elektrisch geschirmt. Die Nahfeldsonde wird an einen Spektrumanalysator oder ein Oszilloskop mit 50Ω Eingang angeschlossen. Die Magnetfeldscannersonde besitzt intern einen Abschlusswiderstand.

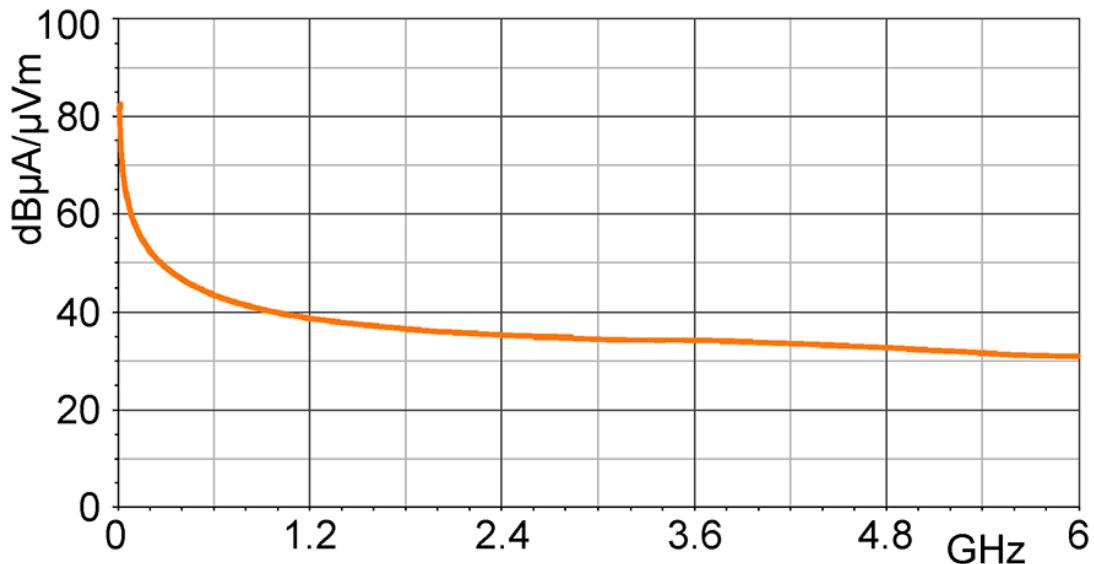
Technische Parameter

Frequenzbereich	30 MHz ... 6 GHz
Auflösung	$\approx 1 \text{ mm}$
Maße Sondenkopf:	$\varnothing \approx 3 \text{ mm}$
Anschluss - Ausgang	SMA, male, jack

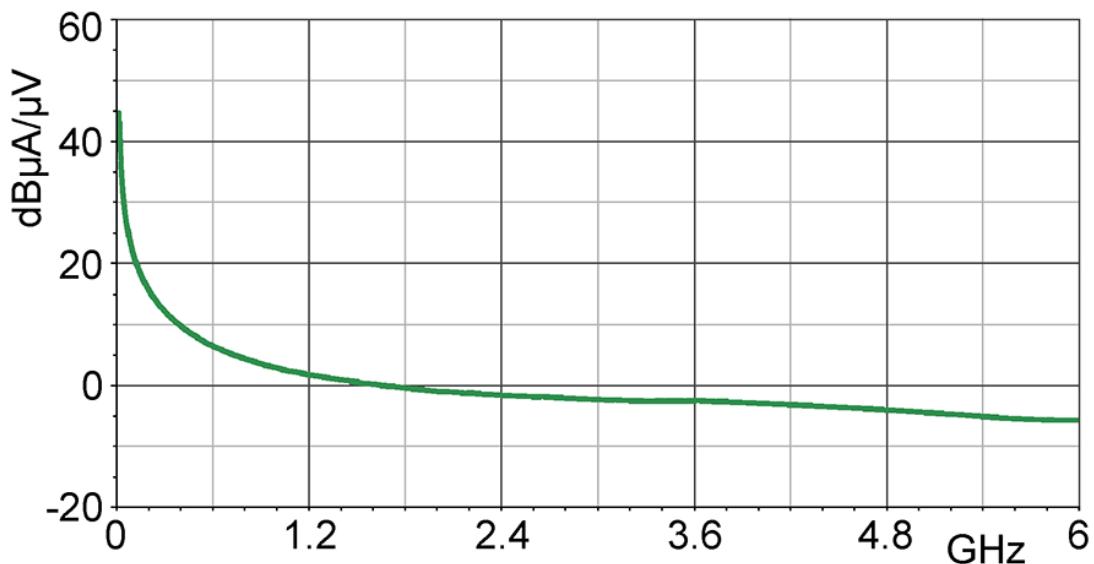
Frequenzgang [$\text{dB}\mu\text{V}$] / [$\text{dB}\mu\text{A}/\text{m}$]



Korrekturkurve H-Feld [$\text{dB}\mu\text{A}/\text{m}$] / [$\text{dB}\mu\text{V}$]



Korrekturkurve Strom [$\text{dB}\mu\text{A}$] / [$\text{dB}\mu\text{V}$]



Messprinzip

